

走査型電子顕微鏡 (SEM)

【メーカー】(株)日立ハイテクノロジーズ

【型式】S-3400N

【設置場所】農学部本館1階1P-108

【仕様】

- ・二次電子像分解能 : 3.0nm保証(高真空)(30kV)
- ・二次電子像分解能 : 10nm保証(高真空)(3kV)
- ・反射電子像分解能 : 4.0nm保証(低真空モード)(30kV)
- ・倍率 : 5~300,000倍
- ・加速電圧 : 0.3~30kV
- ・低真空度設定 : 6~270Pa
- ・イメージシフト : $\pm 50 \mu\text{m}$ (WD=10mm)



機器説明

試料に電子線を当てることで生じる反射電子・二次電子の信号を集積し、表面構造を観察することが可能です。

- 低真空モード対応の反射電子検出器、高真空モード対応の反射電子・二次電子検出器搭載。
 - 植物や虫、金属、微生物、食品など、前処理の施し方によって、多様な試料を測定可。
- ※粉末の場合は真空下での扱いに注意。

付属設備としてEDXを搭載していますので、特性X線解析による元素分析が可能です。

- ・微小部の元素分析
- ・マッピング元素分析